



2021 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 南 陽
代表者名 代表取締役社長 武内英一郎
(コード番号：7417 東証第一部・福証)
問合せ先 常務取締役管理本部長兼
経営企画室長 篠崎 学
T E L 092-472-7331

新製品「全自動光学検査装置」販売開始のお知らせ

当社は、株式会社清和光学製作所（本社：東京都中野区）との間で共同開発した、「全自動光学検査装置」3機種（SRV-300、SRV-300ZPM、SIR-300）を2021年6月より販売開始いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 概要

「全自動光学検査装置」3機種（SRV-300、SRV-300ZPM、SIR-300）は、近年、半導体デバイスの高機能化、微細化に伴い、検査ニーズが多種多様となってきた半導体デバイス市場における省力化および省人化に貢献する目的で開発された装置であります。

「SRV-300」は半導体ウェハの欠陥レビューを行い、「SRV-300ZPM」はレビュー機能に加えて、白色干渉による3次元計測の組み合わせを可能としております。さらに、「SIR-300」では赤外光によるウェハ内部および貼り合わせウェハの表裏パターンズレ検査を可能としております。

「全自動光学検査装置」を導入することにより、従来の目視検査等の検査工程を自動化することができ、SEM Review装置に比べ、安価かつ高速であり、他検査モジュールとの組み合わせや、複数装置にまたがる検査工数の削減、全数検査による半導体ウェハの品質安定化を実現いたします。

なお、受注につきましても2021年6月より開始しており、3年後の年間売上高は10億円を目標としております。



(イメージ図)

< 価格 >

- ① 型式 SRV-300 [Auto Review 検査装置 (Standard 仕様)]
標準価格 1 億 3,000 万円 (税別) / 台
- ② 型式 SRV-300ZPM [Auto Review 検査装置+白色干渉 Zpro (+3D 計測仕様)]
標準価格 1 億 5,000 万円 (税別) / 台
- ③ 型式 SIR-300 [Wafer 内部欠陥 IR 検査装置]
標準価格 1 億 3,000 万円 (税別) / 台

2. 今後の事業に与える影響

本件が今期の当社業績に与える影響は軽微であります。
当社は省力化、省人化への貢献を目的として、引き続き検査装置関連の開発に取り組んでまいります。

本件に関する詳細なお問い合わせは、下記にお願いいたします。
株式会社南陽 産機事業本部 管理部
TEL : 092-473-7711
HP お問い合わせ : <https://www.nanyo.co.jp/jp/contact.html#sanki>
E メールアドレス : infoinfo@nanyo.co.jp

以 上